


ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 171

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczętkarska 42

Wydanie/Issue 8 z/of 17.11.2023

 AP 171	Nazwa i adres / Name and address „LAB MESK” Eugeniusz Stepnowski ul. Deotymy 43a lok. 6 01-441 Warszawa
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ¹⁾ 6.01 długość 6.02 kąt 12.01 siła 12.02 moment siły

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 171 z dnia 24.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 30.12.2020 r. do 15.01.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 171 of 15.03.2023
Accreditation cycle from 30.12.2020 to 15.01.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

„LAB MESK” Eugeniusz Stepnowski ul. Wólczyńska 133, budynek nr 5, lokal nr 54I, 01-919 Warszawa				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,1 mm	(0 ÷ 30) mm (0 ÷ 50) mm	8,6 µm 9,2 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
	(0 ÷ 30) mm (0 ÷ 50) mm	9 µm 10 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm	(0 ÷ 10) mm (0 ÷ 30) mm (0 ÷ 50) mm	2,8 µm 3,1 µm 4,3 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
	(0 ÷ 10) mm (0 ÷ 30) mm (0 ÷ 50) mm (0 ÷ 100) mm	1,2 µm 1,8 µm 2,5 µm 4,7 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,002 mm; 0,001 mm	(0 ÷ 5) mm	2,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,005 mm 0,002 mm 0,001 mm	(0 ÷ 5) mm (0 ÷ 1) mm (0 ÷ 1) mm	0,8 µm 0,7 µm 0,6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,01 mm	(0 ÷ 3) mm	2,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
	(0 ÷ 3) mm	1,2 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej 0,002 mm; 0,001 mm	(0 ÷ 0,6) mm	2,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
	(0 ÷ 0,6) mm	0,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm	(0 ÷ 25,4) mm (0 ÷ 50,8) mm	3,6 µm 4,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
	(0 ÷ 50,8) mm (0 ÷ 100) mm	9 µm 10 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,005 mm	(0 ÷ 25,4) mm (0 ÷ 50,8) mm	3,1 µm 4,5 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
	(0 ÷ 50,8) mm (0 ÷ 100) mm	5 µm 6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,001 mm	(0 ÷ 25,4) mm (0 ÷ 50,8) mm	2,8 µm 4,3 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
	(0 ÷ 12,7) mm (0 ÷ 25,4) mm (0 ÷ 50,8) mm (0 ÷ 100) mm	1,3 µm 1,6 µm 2,5 µm 4,7 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczości 0,01 mm 0,005 mm 0,001 mm	(0 ÷ 1) mm	3,6 µm 3,1 µm 2,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.11 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem głowicy mikrometrycznej
Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0001 mm	(0 ÷ 12,7) mm	1,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.49 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem przyrządu Mahr Precimar ICM 100
Folie wzorcowe	(0 ÷ 1) mm (0 ÷ 2) mm (0 ÷ 3) mm (0 ÷ 4) mm (0 ÷ 5) mm	2,9 µm 5,5 µm 8,2 µm 10,9 µm 13,6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.30 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza poziomego
Głębokościomierze czujnikowe -rozdz. 0,001 mm, 0,002 mm, 0,005 mm -dz. elem. 0,01 mm; rozdz. 0,001 mm -dz. elem. 0,01 mm; rozdz. 0,001 mm -dz. elem. 0,01 mm; rozdz. 0,001 mm -dz. elem. 0,1 mm; rozdz. 0,01 mm	(0 ÷ 5) mm (0 ÷ 10) mm (0 ÷ 30) mm (0 ÷ 50) mm (0 ÷ 50) mm	0,3 µm 0,9 µm 1,3 µm 1,7 µm 6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.16 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Głębokościomierze mikrometryczne	(0 ÷ 25) mm (25 ÷ 50) mm (50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm	1,1 µm 1,6 µm 2,2 µm 2,9 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.17 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Głębokościomierze suwmiarkowe	(0 ÷ 150) mm (0 ÷ 200) mm (0 ÷ 300) mm (0 ÷ 500) mm	10 µm 10 µm 12 µm 17 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.3 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Głowice mikrometryczne	(0 ÷ 25) mm	1,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.31 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Grubościomierze czujnikowe -dz. elem. 0,01 mm; rozd. 0,001 mm -dz. elem. 0,01 mm; rozd. 0,001 mm -dz. elem. 0,1; rozd. 0,01	(0 ÷ 10) mm (0 ÷ 50) mm (0 ÷ 50) mm	1,4 µm 1,4 µm 6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.10 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Macki czujnikowe - do pomiarów wewnętrznych	(2,5 ÷ 12,5) mm (10 ÷ 22) mm (10 ÷ 35) mm (30 ÷ 55) mm (40 ÷ 90) mm	1,1 µm 1,4 µm 1,6 µm 1,8 µm 2,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.22 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Macki czujnikowe - do pomiarów zewnętrznych	(0 ÷ 20) mm (20 ÷ 40) mm (40 ÷ 60) mm (60 ÷ 80) mm (80 ÷ 100) mm	1,0 µm 1,3 µm 1,8 µm 2,3 µm 2,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.22 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Mierniki do pomiaru grubości powłok	(0 ÷ 1000) µm	3,3 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.43 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem folii wzorcowych
Mikrometry wewnętrzne	(5 ÷ 30) mm (25 ÷ 50) mm (50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm	1,1 µm 1,6 µm 2,2 µm 2,9 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.23 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Mikrometry zewnętrzne	(0 ÷ 25) mm (25 ÷ 50) mm (50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm (100 ÷ 125) mm (125 ÷ 150) mm (150 ÷ 175) mm (175 ÷ 200) mm (200 ÷ 225) mm (225 ÷ 250) mm (250 ÷ 275) mm (275 ÷ 300) mm	1,0 µm 1,5 µm 2,2 µm 2,8 µm 3,7 µm 4,3 µm 4,9 µm 5,5 µm 6,2 µm 6,8 µm 7,5 µm 8,1 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.4 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem - układ czujnikowy	od -140 µm do +140 µm	1,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.18
- układ mikrometryczny	(0 ÷ 25) mm (0 ÷ 50) mm	1,2 µm 1,5 µm		Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Pierścienie wzorcowe	(2 ÷ 30) mm	1,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.44 w oparciu o EURAMET cg-6 Version 2.0 (03/2011) Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w czujnik elektroniczny

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Pierścienie wzorcowe	(10 ÷ 50) mm (50 ÷ 80) mm (80 ÷ 110) mm (110 ÷ 150) mm (150 ÷ 190) mm (190 ÷ 225) mm (225 ÷ 260) mm (260 ÷ 300) mm	1,4 µm 1,5 µm 1,7 µm 1,9 µm 2,2 µm 2,4 µm 2,9 µm 3,2 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.6 w oparciu o EURAMET cg-6 Version 2.0 (03/2011) Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w kabłąki
Przymiary półsztywne Przymiary sztywne	(0 ÷ 1000) mm (1000 ÷ 3000) mm (3000 ÷ 5000) mm	0,12 mm 0,18 mm 0,25 mm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.21 Metoda porównawcza z zastosowaniem przymiaru sztywnego
Przymiary wstępowe	(0 ÷ 2000) mm (2000 ÷ 5000) mm (5000 ÷ 8000) mm (8000 ÷ 10000) mm (10000 ÷ 15000) mm	0,14 mm 0,25 mm 0,33 mm 0,37 mm 0,45 mm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.21 Metoda porównawcza z zastosowaniem przymiaru sztywnego
Spoinomierze - pomiar wysokości spoin czołowych - pomiar wysokości spoin pachwinowych - pomiar grubości spoin pachwinowych - pomiar szerokości spoin - pomiar głębokości podcięcia	(0 ÷ 15) mm (0 ÷ 20) mm (0 ÷ 15) mm (0 ÷ 60) mm (0 ÷ 6) mm	0,06 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,6 mm 0,06 mm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.40 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych oraz waleczków pomiarowych
Spoinomierze - wysokość spoiny czołowej - grubość spoiny pachwinowej	(0 ÷ 30) mm	6 µm 12 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.33 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe	średnica podziałowa d ₂ (7 ÷ 87) mm	5,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.46 Metoda pośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe	średnica podziałowa d ₂ (2,1 ÷ 50) mm (50 ÷ 112) mm (112 ÷ 174) mm	3,0 µm 3,1 µm 3,7 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.45 w oparciu o EURAMET cg-10 Version 2.1 (12/2012) Metoda pośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w czujnik elektroniczny
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe	średnica podziałowa d ₂ (9 ÷ 112) mm	5,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.46 Metoda pośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe	średnica podziałowa d ₂ (1,5 ÷ 100) mm (100 ÷ 125) mm	3,0 µm 3,2 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.7 w oparciu o EURAMET cg-10 Version 2.1 (12/2012) Metoda pośrednia z zastosowaniem waleczków pomiarowych i długościomierza Trimos Labconcept Premium 500

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Sprawdziany pierścieniowe gładkie	(2 ÷ 30) mm	1,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.44 w oparciu o EURAMET cg-6 Version 2.0 (03/2011) Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w czujnik elektroniczny
Sprawdziany pierścieniowe gładkie	(10 ÷ 50) mm (50 ÷ 80) mm (80 ÷ 110) mm (110 ÷ 150) mm (150 ÷ 190) mm (190 ÷ 225) mm (225 ÷ 260) mm (260 ÷ 300) mm	1,4 µm 1,5 µm 1,7 µm 1,9 µm 2,2 µm 2,4 µm 2,9 µm 3,2 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.6 w oparciu o EURAMET cg-6 Version 2.0 (03/2011) Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w kabłąki
Sprawdziany specjalne	(5 ÷ 50) mm	1,8 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.48 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w czujnik elektroniczny
	(14 ÷ 50) mm (50 ÷ 80) mm (80 ÷ 110) mm (110 ÷ 150) mm (150 ÷ 190) mm (190 ÷ 225) mm (225 ÷ 240) mm	1,4 µm 1,5 µm 1,7 µm 1,9 µm 2,2 µm 2,4 µm 2,6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.47 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w kabłąki
Sprawdziany tłoczkowe	(0 ÷ 50) mm (50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm (100 ÷ 125) mm (125 ÷ 150) mm (150 ÷ 200) mm	0,9 µm 1,0 µm 1,2 µm 1,3 µm 1,7 µm 2,1 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.14 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500
Suwmiarki	(0 ÷ 150) mm (0 ÷ 200) mm (0 ÷ 300) mm (0 ÷ 500) mm (0 ÷ 600) mm (0 ÷ 800) mm (0 ÷ 1000) mm	10 µm 10 µm 12 µm 17 µm 31 µm 34 µm 38 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.3 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Szczelinomierze	(0,02 ÷ 3) mm	0,9 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.12 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza poziomego
	(0,02 ÷ 3) mm	1,6 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.12 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem mikrometru cyfrowego
Średnicówki czujnikowe	(4 ÷ 18) mm (18 ÷ 50) mm (50 ÷ 150) mm	1,5 µm 2,0 µm 5,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.20 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe	(50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm (100 ÷ 125) mm (125 ÷ 150) mm (150 ÷ 175) mm (175 ÷ 200) mm (200 ÷ 225) mm (225 ÷ 250) mm (250 ÷ 275) mm (275 ÷ 300) mm (300 ÷ 325) mm (325 ÷ 350) mm (350 ÷ 375) mm	1,5 µm 1,8 µm 2,2 µm 2,3 µm 2,8 µm 3,5 µm 4,3 µm 5,2 µm 5,5 µm 5,8 µm 6,1 µm 6,3 µm 6,3 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.25 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500
Średnicówki trójpunktowe mikrometryczne Średnicówki trójpunktowe czujnikowe	(3,5 ÷ 12) mm (12 ÷ 35) mm (35 ÷ 50) mm (50 ÷ 80) mm (80 ÷ 100) mm (100 ÷ 125) mm (125 ÷ 150) mm (150 ÷ 175) mm (175 ÷ 200) mm (200 ÷ 250) mm (250 ÷ 275) mm (275 ÷ 300) mm	1,9 µm 2,0 µm 2,1 µm 2,3 µm 2,8 µm 2,9 µm 3,3 µm 3,5 µm 4,6 µm 4,8 µm 4,9 µm 5,3 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.15 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem pierścieni wzorcowych
Transametry	(0 ÷ 25) mm (25 ÷ 50) mm (50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm	0,9 µm 1,0 µm 1,2 µm 1,3 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.5 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Waleczki pomiarowe	(0 ÷ 20) mm	0,5 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.26 Metoda porównawcza z zastosowaniem płytek wzorcowych oraz czujnika typu MOP 02/20
	(0 ÷ 30) mm	1,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.26 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500
Wysokościomierze suwmiarkowe	(0 ÷ 300) mm (0 ÷ 500) mm (0 ÷ 600) mm (0 ÷ 800) mm (0 ÷ 1000) mm	12 µm 17 µm 20 µm 34 µm 38 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.3 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Wzorce nastawcze do wymiarów wewnętrznych	do 100 mm	2,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.27 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500 wyposażonego w kabłąki
Wzorce nastawcze wymiarów zewnętrznych	25 mm (25 ÷ 50) mm (50 ÷ 75) mm (75 ÷ 100) mm (100 ÷ 125) mm (125 ÷ 150) mm (150 ÷ 175) mm (175 ÷ 200) mm (200 ÷ 225) mm (225 ÷ 250) mm (250 ÷ 275) mm (275 ÷ 300) mm	0,9 µm 0,9 µm 1,0 µm 1,2 µm 1,5 µm 1,6 µm 2,1 µm 2,2 µm 2,3 µm 2,4 µm 2,9 µm 3,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.9 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem długościomierza Trimos Labconcept Premium 500

Wersja strony: A

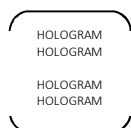
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Kąt				
Kątomierze cyfrowe	(0 ÷ 360)°	3,6'	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.28 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych kątowych
Kątomierze traserskie	(0 ÷ 180)°	0,2°	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.28 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych kątowych
Kątomierze uniwersalne	(4 x 90)°	3,6'	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.28 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych kątowych
Kątowniki 90° dwuramiennie	długość dłuższego ramienia do 315 mm	5,0 µm	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.29 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych oraz kątownika walcowego
Spoinomierze - kąt ukosowania	(80 ÷ 160)°	0,6°	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.40 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych kątowych
Siła				
Siłomierze (dynamometry teletechniczne)	(2 ÷ 245) cN	0,76 cN	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.1
Moment siły				
Klucze dynamometryczne	(1 ÷ 1500) Nm	1,10 %	S	Procedura wewnętrzna IW5.8.2 w oparciu o PN-EN ISO 6789:2017

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 171

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 17.11.2023 r.